

CARACTÉRISATIONS OPTIQUES IN SITU

par Bruno Berini (équipe FOX)

Dans le cadre du Groupe de Tavail Croissance, une série de séminaire démarre autour des activités de croissance par des techniques CVD (OMCVD et CVD assisté plama) et PVD (Ablation laser, pulvérisation cathodique et évaporation par effet joule). Le premier exposé est consacré aux caractérisations optiques installées sur un bâti d'ablation Laser. Après une brève introduction sur la technique d'ablation Laser, les techniques de spectrométrie d'émission, d'ellipsométrie spectroscopique et de thermométrie Infra rouge seront abordées. Pour les deux dernières, l'accent sera mis sur la caractérisation in situ et à haute température de la transition métal-isolant dans les oxydes ternaires de structure perovskite (LaNiO3 et SrTiO3) élaborés par ablation laser en couches minces et héterostructures.